



中華民國專利證書

發明第 I 653440 號

發明名稱：光譜影像相關比對式共焦形貌量測系統及方法

專利權人：國立臺灣大學

發明人：陳亮嘉、譚培汝

專利權期間：自 2019 年 3 月 11 日至 2037 年 12 月 26 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局局長

洪淑敏

中華民國



108

年

3

月

11

日

